

中国科学院地质与地球物理研究所 纳米离子探针实验室用户须知



2020/09/01

地址:北京市朝阳区北土城西路 19 号,建德桥东 100 米,中国科学院地质与地 球物理研究所,综合办公楼 149 室。 Email: sean_hao@mail.iggcas.ac.cn 联系电话: 86-10-82998009

目录

纳米离子探针实验室预约实验流程	3
关于样品制备的特别说明	3
纳米离子探针实验室分析方法介绍	4
超高空间分辨锆石 U-Pb/Pb-Pb 定年	4
RF 氧源超高空间分辨、高信噪比矿物微量元素成图分析	6
矿物微量元素分布图像分析(定量)	8
生物、环境样品元素及同位素图像分析	10
磷灰石和硅酸盐玻璃水含量和 H 同位素分析	12
高空间分辨 C-O-S 同位素分析	13
纳米离子探针实验室样品制备说明	15

样品尺寸	16
树脂要求	17
生物和微粒样品制备	17
岩石、矿物和材料样品制备	19
水含量及 H 同位素分析样品制备	19
样品定位	20

纳米离子探针实验室预约实验流程

- 仔细阅读《纳米离子探针实验室分析方法介绍》,了解这些方法的适用范围 和分析精度,以及对样品制备的要求。如有疑问,可电话咨询 010-82998009。
- 填写预约申请表,邮件发送至 <u>sean_hao@mail.iggcas.ac.cn</u>。实验室会在第 一时间回复。
- 3) 预约成功后,仔细阅读《纳米离子探针实验室样品制备说明》,提前准备样品,并送到实验室给工程师检查。如不方便来实验室,请详细描述样品的制备过程,并与样品照片一起,发送至 <u>sean_hao@mail.iggcas.ac.cn</u>。实验室将确定样品状态是否满足上机要求。
- 等待实验室工程师通知上机实验时间,在此期间,完成样品的光学显微镜和 电子显微镜照相(否则将无法定位待测样品位置)。
- 5) 收到通知后,提前1-3天将样品送至实验室,并放入仪器抽真空。
- 6) 上机实验。
- 7) 实验室工程师检查、核对、处理实验数据,并提交给用户。

关于样品制备的特别说明

- 样品制备对纳米离子探针分析至关重要,由于本实验室人手有限,不能提供
 样品制备服务,需要用户自行进行样品制备,但实验室可提供指导。
- 2) 如样品制备达不到仪器分析的要求,实验室有权取消实验。
- 如制备的样品发生严重去气,破坏仪器真空,导致仪器机时的浪费,由用户 自行承担,即用户需要为浪费的机时付费。
- 4) 如制备的样品平整度不符合要求,将影响分析精度。

纳米离子探针实验室分析方法介绍

实验室对外提供服务的方法包括:

- 1) 超高空间分辨锆石 U-Pb/Pb-Pb 定年
- 2) RF 氧源超高空间分辨、高信噪比矿物微量元素成图分析
- 3) 矿物微量元素分布图像分析(定量分析)
- 4) 生物、环境样品元素及同位素图像分析
- 5) 磷灰石和硅酸盐玻璃水含量和 H 同位素分析
- 6) 高空间分辨 C-O-S 同位素分析

超高空间分辨锆石 U-Pb/Pb-Pb 定年

- ➢ 离子源: 源
- 样品类型: 锆石或斜锆石(岩石薄片中或包埋于树脂中)
- ▶ 适用范围:老于 2.0 Ga
- ▶ 空间分辨率: 3-5 微米
- 单个点分析时间:大约30分钟

注:此方法仅适用于微细锆石或复杂环带锆石,而且只能分析较老的锆石。如果 锆石年轻,或者待测区域大于 10 微米 (不需要高空间分辨),应当使用离子探 针 1280 进行分析,离子探针实验室电话: 010-82998148。



锆石 U-Pb 和 Pb-Pb 定年(分析点大小和结果)

参考文献:

- [1] Yang W, Lin Y-T, Zhang J-C, Hao J-L, Shen W-J, Hu S: Precise micrometre-sized Pb-Pb and U-Pb dating with NanoSIMS. Journal of Analytical Atomic Spectrometry 2012, 27:479-87.
- [2] Wang W, Liu X, Hu J, Li Z, Zhao Y, Zhai M, Liu X, Clarke G, Zhang S, Qu H: Late Paleoproterozoic medium-P high grade metamorphism of basement rocks beneath the northern margin of the Ordos Basin, NW China: Petrology, phase equilibrium modelling and U–Pb geochronology. Precambrian Research 2014, 251:181-96.
- [3] Hu, S., Lin Y-T, Yang W, Wang W, Zhang J-C, Hao J-L, Xing W: NanoSIMS imaging method of zircon U-Pb dating. Science China Earth Sciences 2016, 59(11): 2155-2164.

RF 氧源超高空间分辨、高信噪比矿物微量元素成图分析

- ▶ 离子源: RFO源
- 样品类型: 锆石, 硅酸盐玻璃, 磷灰石以及矿床学样品等复杂基体样品(岩石薄片中或包埋于树脂中)
- ▶ 适用范围:待测元素 > ppm
- ➢ 空间分辨率: < 300 纳米</p>
- 单个区域分析时间:大约1-1.5小时(20微米-30微米区域)
- 分析元素:一次分析最多只能测量5个元素(请在申请表中标明待测元素)
- ▶ 其他:
 - (1) 分析区域加大需要提高分析时间以提升图像信噪比
 - (2) 对于微量元素图像后期需采用降噪方法提升图像质量
 - 例1 稀土矿样品微量元素 Mapping:



像素: 512x512, 扫描大小(μm): 40, 分析时间 (秒): 47323 208Pb*,232Th* 为降噪处理后的图像

- 4%Ti
 9°Zr

 6
 100 pA

 70°Pb
 238U

 20°Pb
 238U

 238U
 238U

 20°Pb
 238U

 8
 1024x1024

 21
 206Pb 238U

 238U
 206Pb 238U

 98
 8
- 例2 锆石稀土元素及 Pb U Mapping:

矿物微量元素分布图像分析 (定量)

- ▶ 离子源: 黄铁矿微量元素采用 Cs 源, 其他矿物为 O 源
- 样品类型: 锆石, 硅酸盐玻璃, 黄铁矿, 磷灰石(岩石薄片中或包埋于树脂中)
- ▶ 适用范围: 待测元素含量 > ppm
- ▶ 空间分辨率: <1 微米
- ▶ 单个区域分析时间: 20-40 微米², 大约 30 分钟

▶ 分析元素:一次分析最多只能测量5个元素(请在申请表中标明待测元素)



锆石微量元素分析(Y元素的分布图像及含量变化)

注:此方法可以通过图像获得目标区域任意位置的微量元素分布图像,通过对离 子图像的处理,可以获得微量元素在任意点、线、面上的变化。

参考文献:

- [4] Hao J L, Yang W, Luo Y, et al. NanoSIMS measurements of trace elements at the micron scale interface between zircon and silicate glass[J]. Journal of Analytical Atomic Spectrometry, 2016, 31(12): 2399-2409.
- [5] Yang W, Lin Y, Hao J, et al. Phosphorus-controlled trace element distribution in zircon revealed by NanoSIMS[J]. Contributions to Mineralogy and Petrology, 2016, 171(3): 1-16.

[6] Zhang J, Lin Y, Yang W, et al. Improved precision and spatial resolution of sulfur isotope analysis using NanoSIMS[J]. Journal of Analytical Atomic Spectrometry, 2014, 29(10): 1934-1943.

生物、环境样品元素及同位素图像分析

- ➢ 离子源: Cs 源
- 样品类型:组织冷冻切片(固定在 Si 片上),细菌或土壤颗粒(分散在 Si 片上)
- ▶ 适用范围: C、N、O、Si、S 元素或同位素, F、Cl、Ca、Mg、Fe 元素
- ▶ 空间分辨率: < 300 纳米
- ▶ 单个区域分析时间: 20-40 微米², 大约 30 分钟

注:由于缺少标样,本方法只能测量元素或同位素在空间上的相对变化,不能进行定量分析。如需要定量或半定量分析,用户可以自己准备标准物质,标准物质 在结构和成分上应该尽可能与待测样品一致。



元素分布图像(左图为组织切片,右图为土壤颗粒)

参考文献:

[7] Feng ZT, Deng YQ, Zhang SC, Liang X, Yuan F, Hao JL, Zhang JC, Sun SF, Wang BS: K(+) accumulation in the cytoplasm and nucleus of the salt gland cells of Limonium bicolor accompanies increased rates of salt secretion under NaCl treatment using NanoSIMS. Plant science: an international journal of experimental plant biology 2015, 238:286-96.

[8] Xiao J, Wen Y, Li H, Hao J, Shen Q, Ran W, Mei X, He X, Yu G: In situ

visualisation and characterisation of the capacity of highly reactive minerals to preserve soil organic matter (SOM) in colloids at submicron scale. Chemosphere 2015, 138:225-32.

磷灰石和硅酸盐玻璃水含量和 H 同位素分析

- ▶ 离子源: Cs 源
- 样品类型:磷灰石和硅酸盐玻璃(矿物或岩石压入铟金属中)
- ➤ 适用范围: >10ppm
- ▶ 空间分辨率: 1-10 微米
- 单个点分析时间:大约 5-8 分钟

注:水含量和 H 同位素分析对仪器的真空要求极高,需要特殊的样品制备流程, 详细见样品制备说明。



玄武岩玻璃和磷灰石的 H 同位素分析结果

参考文献

- [9] Hu S, Lin Y, Zhang J, Hao J, Yang W, Deng L: Measurements of water content and D/H ratio in apatite and silicate glasses using a NanoSIMS 50L. J Anal At Spectrom 2015, 30:967-78.
- [10] Hu S, Lin Y, Zhang J, Hao J, Feng L, Xu L, Yang W, Yang J: NanoSIMS analyses of apatite and melt inclusions in the GRV 020090 Martian meteorite: Hydrogen isotope evidence for recent past underground hydrothermal activity on Mars. Geochimica et Cosmochimica Acta 2014, 140:321-33.

高空间分辨 C-O-S 同位素分析

▶ 离子源: Cs 源

▶ 样品类型:

◆ 硫同位素: 黄铁矿、黄铜矿(岩石薄片中或包埋于树脂中)

◆ 氧同位素:石英、橄榄石、锆石、方解石(岩石薄片中或包埋于树脂中)

◆ C同位素:石墨、金刚石(岩石薄片中或包埋于树脂中)

▶ 空间分辨率: 1-10 微米

单个点分析时间:大约 5-8 分钟

注:本方法是高空间分辨的同位素分析,分析精度相对于 1280 离子探针较差。 C-O-S 同位素分析精度如下图所示。制备样品需保证样品的表面平整度,其对 分析精度有巨大影响。



金刚石和石墨 C 同位素分析(空间分辨 3-10 微米)



方解石 O 同位素分析(空间分辨 5 微米)



参考文献

- [11] Yang W, Hu S, Zhang J, Hao J, Lin Y: NanoSIMS analytical technique and its applications in earth sciences. Science China Earth Sciences 2015, 58:1758-67.
- [12] Lin Y, Feng L, Hao J, Liu Y, Hu S, Zhang J, Yang W: Sintering Nano-crystalline Calcite: A New Method of Synthesizing Homogeneous Reference Materials for SIMS Analysis. Journal of Analytical Atomic Spectrometry 2014.
- [13] Zhang J, Lin Y, Yang W, Shen W, Hao J, Hu S, Cao M: Improved precision and spatial resolution of sulfur isotope analysis using NanoSIMS. J Anal At Spectrom 2014, 29:1934-43.

纳米离子探针实验室样品制备说明

纳米离子探针的样品制备对于获得高质量的分析数据,提高机时效率极为关键, 上机测试的样品必须满足以下要求:

- **固态无挥发性。**这是保证仪器高真空工作状态的必要条件。除样品需烘干之外,采用合适的环氧树脂,并最大限度减少树脂的使用量是关键。对于将要进行水和 H 同位素分析的样品,这一条至关重要,仪器的真空度对分析精度有巨大影响。
- 表面高度平整。样品表面的平整度对离子探针分析的精确度和准确度有显著 影响。因此,要求试样磨制成高质的抛光片,在低倍反光显微镜下呈大面积 的镜面。
- 3) 表面导电。不导电的样品(如岩石样品)需要喷镀金膜或碳膜。
- 4) 固定尺寸。本实验室纳米离子探针样品台可支持直径为 10 毫米, 1/2 英寸, 1 英寸三种尺寸的圆形样品靶(厚度<4 mm)。

为满足上述要求,一般情况下样品制备都包括如下流程:

- 将样品制备成合适的尺寸。生物或微细颗粒样品,一般是置于圆形硅片上; 岩石、矿物或材料样品,一般是包埋于树脂中,制备成圆形的样品靶;需要 进行水含量和H同位素分析的样品,一般是压在圆形的金属铟靶中。
- 2) 选取的材料不去气。由于硅片和铟靶基本不去气,所以这一条特指树脂的选取。通常情况下,其它离子探针(如:SHRIMP和ims-1280)的样品靶不能 满足纳米离子探针的真空要求,建议重新制样(采用不去气树脂,配方见后 文)。如果无法重新制样,推荐对样品靶做如下处理:将树脂靶切磨成1毫 米厚(减少树脂量),并提前3天将样品靶放入仪器抽真空(增加抽真空时 间)。
- 3) 打磨抛光。对于高精度同位素分析,平整度至关重要。
- 4) 喷镀金/碳。实验室免费提供此项服务。
- 5) 光学和电子显微镜拍照。由于纳米离子探针的反光光学摄像头的视域固定为 1000 μm ×1000 μm (放大倍数为~400 倍),定位待测区域非常困难。因此, 需要对整个样品靶进行高分辨拍照并拼出全景照片(详见后文)。

15

样品尺寸

纳米离子探针的样品盘有 3 种不同尺寸的孔, 分别可以放入 3 种不同直径的圆形 样品靶, 分别是: 10 mm、12.7 mm(1/2 inch)、25.4 mm (1 inch)。每个孔的尺寸 范围如下:

尺寸	最大	最小	10 mm *
10mm	10.4mm	9.0mm	25.4 mm
1/2inch	13.1mm	11.7mm	
1inch	25.7mm	24.4mm	

样品的尺寸必须在上述最大和最小值范围内,偏大则无法放入样品孔,偏小则无法固定。样品的厚度要求是1-2 mm,载玻片与硅片的厚度均可满足。

目前,实验室有3种不同型号的样品盘,它们分别能够放置不同数量和型号的样品靶,如下图所示:



1 X1 inch 2X1/2 inch 2X10mm

4X10mm 8X10mm

▶ 5 孔样品盘:可放置1个1inch 样品靶、2个1/2inch 样品靶和2个10mm 样品靶。

- ▶ 4 孔样品盘:可放置 4 个 10mm 样品靶。
- ▶ 8 孔样品盘:可放置 8 个 10mm 样品靶。

树脂要求

在制备矿物或岩石样品时,通常将样品包埋在树脂中。纳米离子探针对真空度有极高的要求,高于其它离子探针。普通树脂在真空中会发生去气,破坏仪器真空, 严重时导致实验无法进行。

为达到纳米离子探针分析的要求,通常需要做如下处理:

- 使用高真空条件下没有明显去气的树脂(如下面推荐的配方)。
- 最大限度减少树脂的用量(例如,将树脂靶磨到非常薄,或者岩石样品粘接 在圆载玻片上,磨成100~300 微米的薄切片)。

推荐树脂配方:

- a) Araldite 506 resin
- b) 1.8-Diamino-p-menthane (DAP)
- c) 1- (2-Aminoethyl) piperazine (AEP) (纯度 99%)

上述三种试剂的配比为 a: b: c = 10: 1.7: 1.8; 固化温度为 40-50 摄氏度, 固 化时间 24 小时。

生物和微粒样品制备

微细生物样品和微粒样品(如 PM2.5, 粒径<5 微米):将样品分散在液相中(如: 酒精、丙酮、mill-Q 高纯水),形成合适浓度的悬浮液,然后滴在事先准备好的 导电基片上(如硅片、金箔、喷镀 TiO₂的玻片),最后烘干。



分散在金箔的微粒样品扫描电镜图像

细胞和细胞器样品:为了不破坏细胞膜结构,需要对样品进行快速高压冷冻超薄 切片,样品的完整性取决于冷冻的速度,切片厚度为 500 到 1000 纳米。之后将 切片转移到硅片或铜网上。待样品自然干燥后,再进行纳米离子探针分析。或者 将切片品包埋在树脂中,打磨至待测平面,方法类似于后文的岩石、矿物或材料 样品制备,需特别注意树脂的选择和用量。



盐腺细胞器超薄冷冻切片二次电子图像及纳米离子探针分析图像

岩石、矿物或材料样品制备

将样品包埋在树脂中, 打磨至待测平面, 抛光并喷镀金膜或碳膜之后, 放入仪器 进行分析。这种方法广泛应用于其它离子探针(如: SHRIMP 和 ims-1280)的样 品制备。

但是,通常情况下,**其它离子探针的样品靶并不能满足纳米离子探针的真空要求,** 主要是因为其使用的树脂去气严重,所以,我们建议重新制样。

如果无法重新制样,推荐对样品靶做如下处理:

- ➢ 将树脂靶切磨成1毫米厚(减少树脂量)
- ▶ 同时,提前3天将样品靶放入仪器抽真空(增加抽真空时间)

探针片或光薄片,如果尺寸符合纳米离子探针的要求,可以直接放入仪器分析。 由于树脂用量少,其抽真空的时间相对要短一些,但仍然需要至少提1天将样品 放入仪器。如果样品是长方形的探针片或光薄片,需要将其切割为符合要求的圆 形。

水含量及 H 同位素分析样品制备

对于需要进行水含量和 H 同位素分析的样品,由于真空度与分析本底密切相关, 因此不能将树脂包埋的样品放入仪器进行分析。

具体制样步骤如下:

- ▶ 将样品埋入可溶性树脂(如:crystalbond,提纯的松香),打磨抛光
- 用丙酮将可溶性树脂溶解,并清洗 5~6次,每次间隔时间 4~6小时,确保树 脂完全被清洗干净
- 105 摄氏度烘干样品 12 小时
- 将样品(岩石或矿物颗粒)压在金属铟靶中。

由于流程较复杂,用户可以将样品带至本实验室制备,实验室将提供指导。

样品定位

由于纳米离子探针的反光光学摄像头的视域**固定**为 1000 ×1000 微米² (放大倍数约为 400 倍)。而待测区域的大小一般为 5-40 微米,为了在上机实验时能找 到待测区域,需要对样品靶进行高分辨照相,并完成全景拼图

全区域定位:提供整个样品的反光图像拼图或扫描电镜图像拼图。下图是样品靶的全景图像。可以根据样品靶边缘标志性位置,建立图像坐标和纳米离子探针样品台坐标的一一对应关系,从而可以通过图像坐标快速定位待测区域。然而,这种方式的定位精度一般在 40-50 微米,仍然不足以找到 10 微米以内的待测目标。



样品靶全景图像(通过此图可以快速定位待测区域)



样品靶局部图像(进一步实现更高精度的定位)

对于颗粒特别小(2-5 微米)的锆石,如需要进行原位定年,为了保证高分析精度,需要极精确的定位。此时需要在分析之前使用 Focus Ion Beam (FIB)在颗 粒附近区域进行标记,将 Pt 沉降在待测锆石旁边(如下图),便于离子探针定位。 此方法的定位精度可达 1-2 微米。可联系本所 FIB 及 TEM 实验室完成标记实验 (负责人谷立新 TEL: 82998592)。



在样品旁边沉积 Pt 线条实现超高精度定位

(完)